

Advanced Semiconductor ICs Reliability

Advanced Electronics + Data Science

2 Maggio ore 9.30

Aula Magna Dipartimento di Ingegneria

- 9.30** **Saluto del Direttore del Dipartimento di Ingegneria**
Prof. Ermanno Cardelli
- 9.40** **La Ricerca Scientifica in ELES**
Ing. Francesca Zaffarami, *CEO ELES*
- 10.00** **Collaboration Opportunities with the Fraunhofer ENAS Institute**
Dr. Harald Kuhn, *Head of Fraunhofer Institute for Electronic Nano Systems ENAS.*
- 10.20** **Semiconductor ICs Reliability Test**
Ing. Alessandro Maseri, *Application Development Manager ELES*
- 10.40** **Auto Diagnosi di Elettronica Integrata in Silicio per Applicazioni ad Alta Affidabilità**
Prof. Federico Alimenti, *Dipartimento di Ingegneria*
- 11.00** **Data Science e Artificial Intelligence per i Test di Alta Affidabilità**
Prof. Gianluca Reali, *Dipartimento di Ingegneria.*
- 11.15** **Chiusura dei Lavori**

ELES – RETE (Reliability Embedded Test Engineering)
THE FAST ROADMAP TO ZERO DEFECTS